

D233293



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D233293 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 09 月 01 日

(21)申請案號：112304606

(22)申請日：中華民國 112 (2023) 年 09 月 06 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-03

(30)優先權：2023/03/06 日本

2023-004350

(71)申請人：日商日本麥克隆尼股份有限公司 (日本) KABUSHIKI KAISHA NIHON MICRONICS
(JP)

日本

(72)設計人：竹谷敏永 TAKEYA, TOSHINAGA (JP)；岸康貴 KISHI, YASUTAKA (JP)

(74)代理人：洪武雄；陳昭誠

(56)參考文獻：

TW D207332

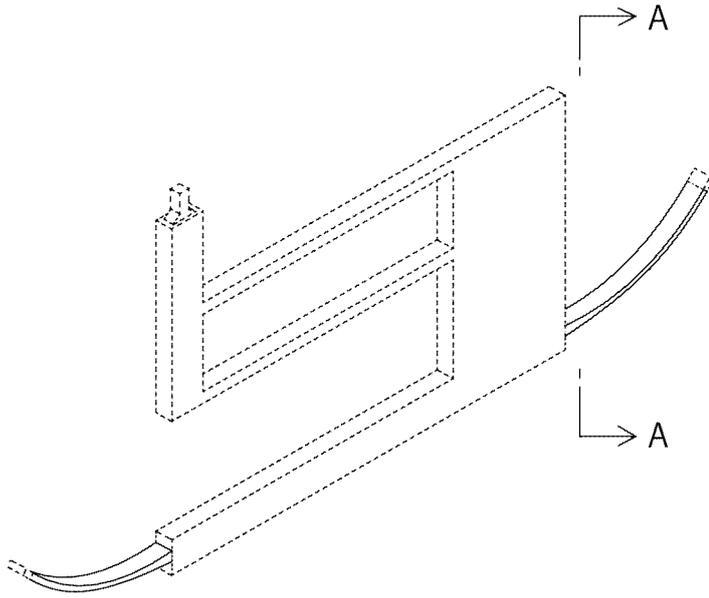
審查人員：朱哲慶

圖式數：11 共 12 頁

(54)名稱

電性接觸件

代表圖：



【立體圖】



D233293

【設計說明書】

【中文設計名稱】 電性接觸件

【英文設計名稱】 ELECTRIC CONTACT

【物品用途】

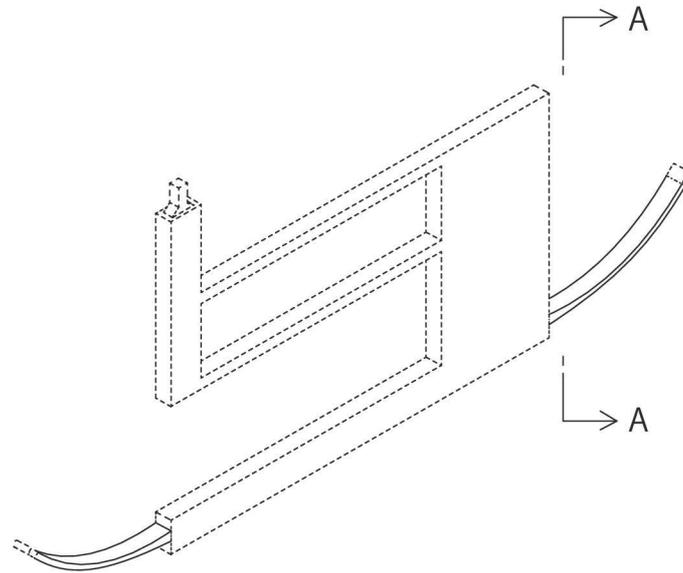
【0001】 本物品係用以對半導體晶片等半導體元件的電特性進行試驗檢查的電性接觸件，且係組裝於半導體元件的試驗檢查裝置而使用者。

【設計說明】

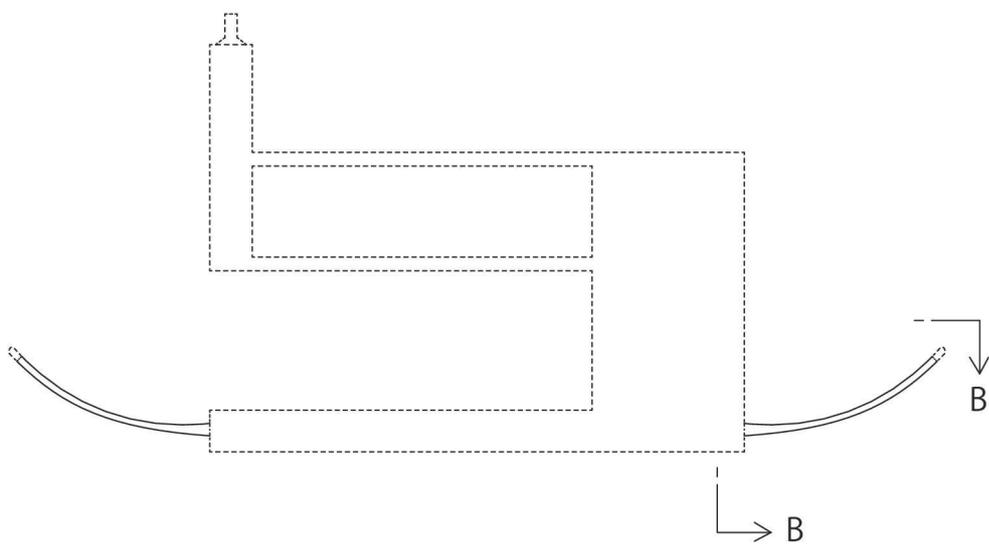
【0002】 本物品的設計要點在於物品的形狀。

【0003】 圖式所揭露之虛線部分為本案不主張設計之部分。圖式所揭露之一點鏈線僅為本案欲主張設計之部分與不主張設計之部分之分界線，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。

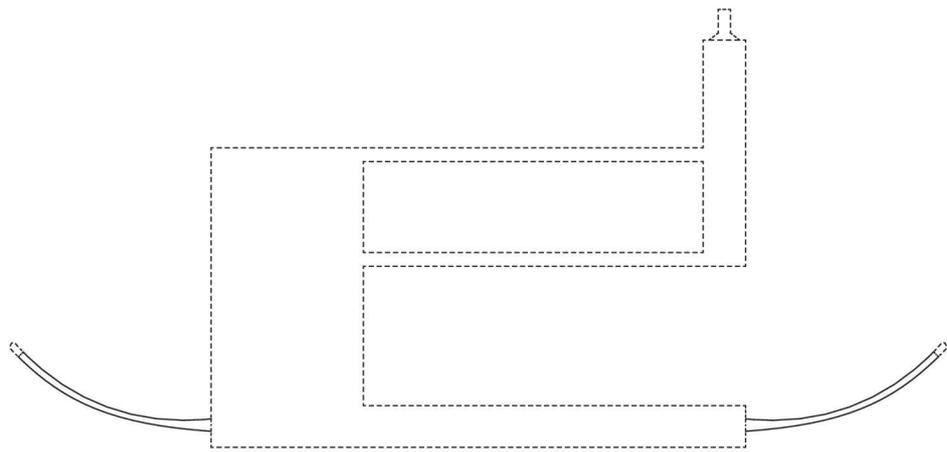
【設計圖式】
(指定代表圖)



【立體圖】



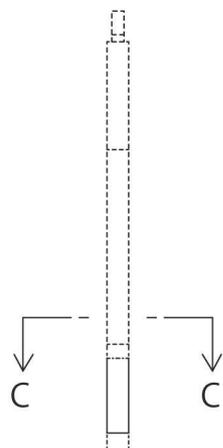
【前視圖】



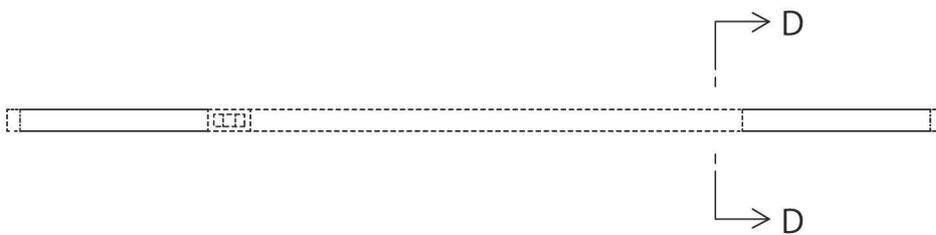
【後視圖】



【左側視圖】



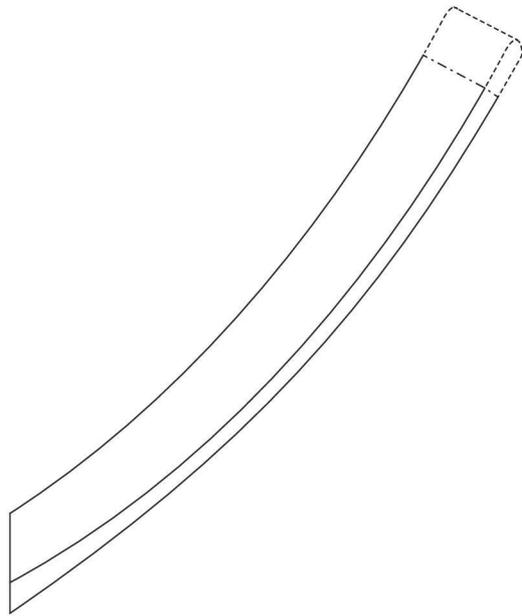
【右側視圖】



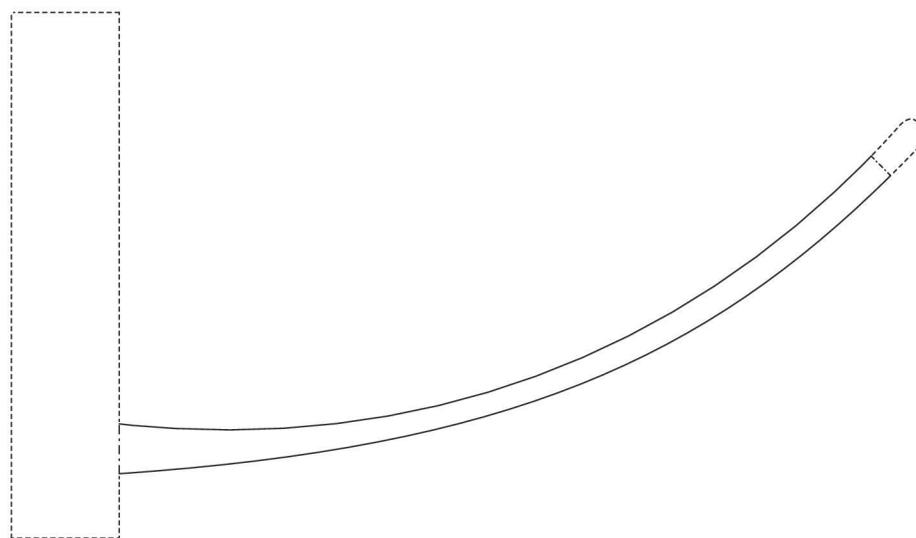
【俯視圖】



【仰視圖】



【立體圖的A-A部分放大圖】



【前視圖的B-B部分放大圖】



【右側視圖的C-C部分放大圖】



【俯視圖的D-D部分放大圖】